

47A, 600V DP MOS功率管

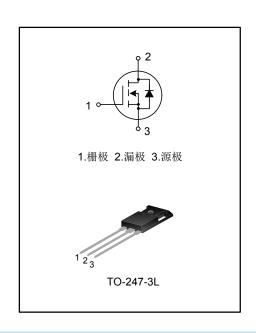
描述

SVS47N60P7 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子 DP MOS 技术新平台制造,具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效,高功率密度,提高热行为。

此外, SVS47N60P7应用广泛。如,适用于硬/软开关拓扑。

特点

- 47A, 600V, $R_{DS(on)(\text{APM})}=55m\Omega @V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



产品规格分类

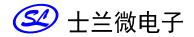
产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVS47N60P7	TO-247-3L	SVS47N60P7	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, T_c=25°C)

参 数 名 和		符号	参 数 范 围	单 位	
漏源电压		V_{DS}	600	V	
栅源电压		V_{GS}	±30	V	
	T _C =25°C	I _D	47		
漏极电流	T _C =100°C		30	Α	
漏极脉冲电流		I_{DM}	140	Α	
耗散功率(Tc=25°C) - 大于25°C每摄氏度减少		415		W	
		P_D	3.32	W/°C	
单脉冲雪崩能量 (注 1)		E _{AS}	2103	mJ	
工作结温范围		T_J	-55~+150	°C	
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150	°C	

热阻特性

参 数 名 称	符号	参 数 范 围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{ heta JC}$	0.3	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	50	°C/W



电气参数(除非特殊说明, T_c=25°C)

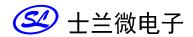
参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	600			V
漏源漏电流	I _{DSS}	V _{DS} =600V, V _{GS} =0V			1.0	μA
栅源漏电流	I _{GSS}	V_{GS} =±30V, V_{DS} =0V			±100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}$, $I_D=250\mu A$	2.0		4.0	V
静态漏源导通电阻	R _{DS(on)}	V _{GS} =10V, I _D =30A		55	70	mΩ
输入电容	C _{iss}			3902		
输出电容	C _{oss}	V _{DS} =25V, V _{GS} =0V, f=1.0MHz		237		pF
反向传输电容	C _{rss}			3.5		
开启延迟时间	$t_{d(on)}$			19		
开启上升时间	t _r	V_{DD} =380V, V_{GS} =13V, R_{G} =1.8 Ω , I_{D} =47A	1	39		
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		1	87		ns
关断下降时间	t _f	(注 2,3)	1	47		
栅极电荷量	Q_{g}	V _{DD} =380V, V _{GS} =10V,	-1	87		
栅极-源极电荷量	Q_gs	I _D =47A	-1	15		nC
栅极-漏极电荷量	Q_gd	(注 2,3)	-1	40		

源-漏二极管特性参数

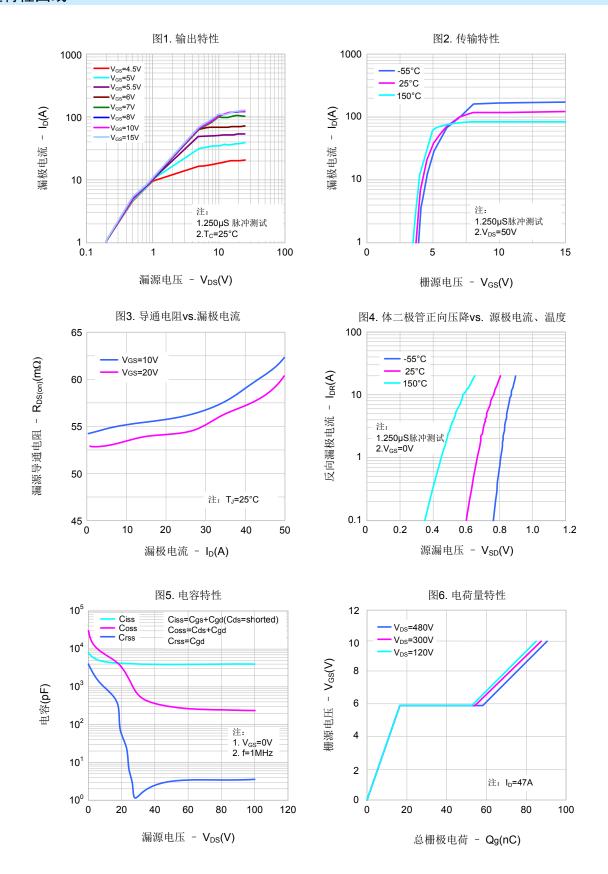
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	Is	MOS 管中源极、漏极构成的		-	47	
源极脉冲电流	I _{SM}	反偏 P-N 结			140	Α
二极管压降	V_{SD}	I _S =47A,V _{GS} =0V			1.4	٧
反向恢复时间	Trr	I _S =47A,V _{GS} =0V,		640		ns
反向恢复电荷	Q _{rr}	dI _F /dt=100A/µs (注 2)		15		μC

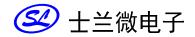
注:

- 1. L=30mH, I_{AS} =11A, V_{DD} =100V, R_{G} =25 Ω , 开始温度 T_{J} =25 $^{\circ}$ C;
- 2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%;
- 3. 基本上不受工作温度的影响。

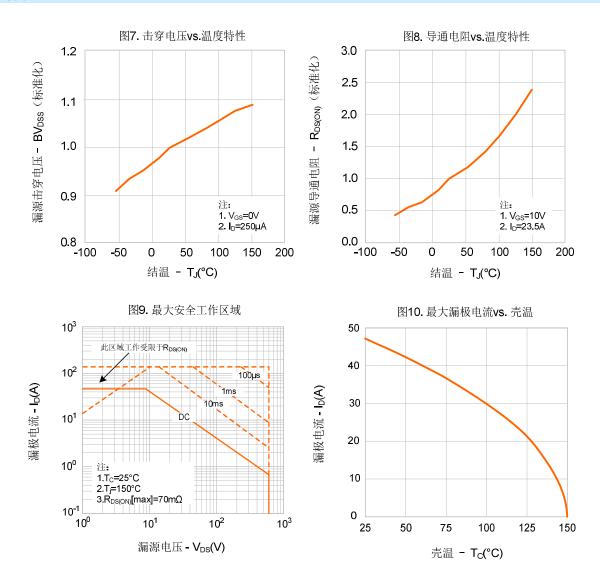


典型特性曲线



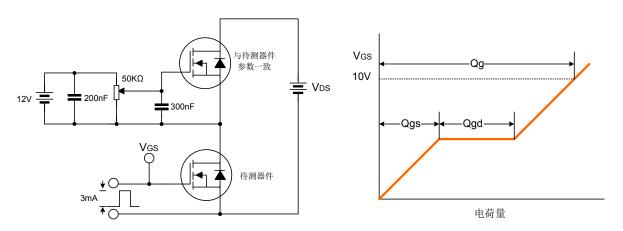


典型特性曲线 (续)

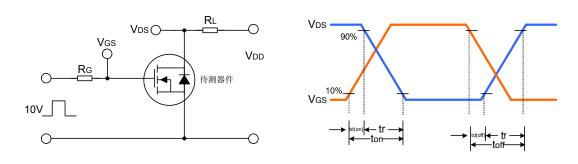


典型测试电路

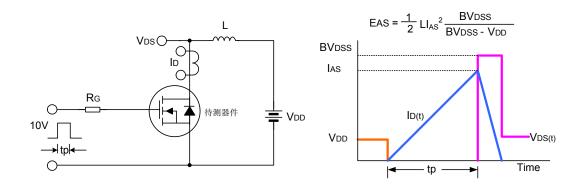
栅极电荷量测试电路及波形图

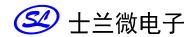


开关时间测试电路及波形图

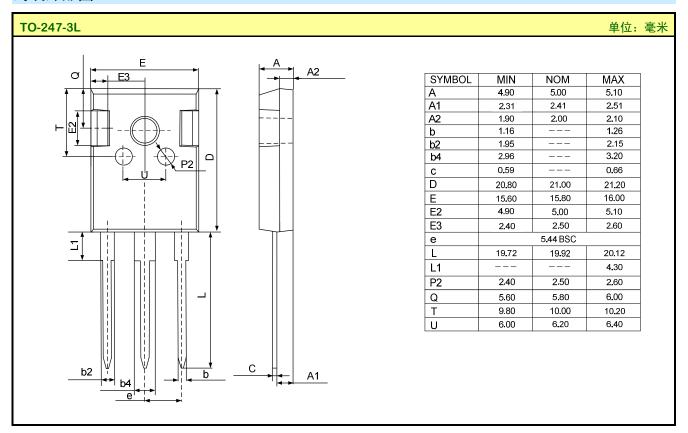


EAS测试电路及波形图





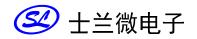
封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

版本号: 1.1



SVS47N60P7 说明书

产品名称: SVS47N60P7 文档类型: 说明书

版 权: 杭州士兰微电子股份有限公司 公司主页: http://www.silan.com.cn

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改图 5 和封装外形图

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布

版本号: 1.1 共7页 第7页